

ご挨拶

新しい年がスタートしました。皆様方には清々しい新年を迎えられていることと心からお慶び申し上げます。

新産業革命が進行している中で、業務領域でも少しずつ変化が生じています。例えば ESD 事業では半導体デバイスが小さくなってきている事からそれらのデバイスを組合せたモジュール自体も小さくなり、静電気破壊検査が必要とされますので、新たな検査装置を開発して対応を進めています。また、生産工程でのデータの一つとして静電気可視化装置が使われだし、より使いやすくする為の無線化の要望もあり、その対応を進めようとしています。さらに OEM 事業の一つに、地元企業と連携して、中小規模河川の水位を監視し防災対策等に役立てようとしている水位計があります。現在の技術革新の後押しを受けて、より精度の高い環境情報のモニタリング機能、ネットワーク機能を搭載し、防災活動等に役立てる事を目指しています。

今年は、「技術革新」に加えて「環境保護」、「持続可能な未来づくり」をキーワードにして、お客様や地域企業の皆様と連携しながら、活動を進める事になると思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

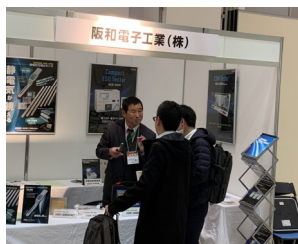
代表取締役 長谷部 巧

● Topics 1

RCJ 信頼性シンポジウム

RCJ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター
Reliability Center for Electronic Components of Japan

11月27日(水)、28日(木)の2日間、東京都大田区蒲田の大田区産業プラザにて開催されました第29回 RCJ 信頼性シンポジウムに参加、出展しました。



ブースの様子

本シンポジウムでは、静電気関連問題を中心に扱う EOS/ESD/EMC シンポジウムと電子デバイス・電子部品の信頼性問題を中心に扱う電子

デバイスの信頼性シンポジウムが行われ、また、関連企業による展示会及びワークショップも同時開催されました。

弊社から EOS/ESD/EMC シンポジウムには、取締役 開発部長 澤田真典が「CDM 試験時における電圧波形の測定についての考察」、第一営業部 宮本佳明が「除電による



講演する澤田部長



講演する宮本佳明

絶縁体の表面電位の推移について」をそれぞれ発表しました。また、表彰式では、第一営業部 宮本佳明が長年の功績により功労賞を受賞しました。

本シンポジウムに併設された信頼性・ESD 対策

技術展示会には、弊社の静電破壊自動測定器 HED-S5000 と静電気可視化モニタシステムを出展しました。

展示会場同じフロアで行われたワークショップでは、第一営業部 岩橋直也が静電気可視化システムの製品紹介をさせていただきました。

今回もたくさんの方々から貴重なご意見、ご要望を頂くことができ、これからの製品改良や新製品開発に役立ててまいります。



ワークショップで製品紹介する岩橋直也

● Topics 2

光学外観検査装置

11月、プリント基板組立ラインに「光学外観検査装置」を新規導入しました。本装置は、高速また1200万画素の高画像度の2次元検査、4方向の3Dプロジェクターを搭載し、高さ、傾斜面を3次元検査可能、500万画素の4方向アングルカメラ搭載、高精度レーザー測定など多様な検査機能を備えたオールインワン機。微小化が進む電子部品に対応していくため、本装置をプリント基板の部品実装ラインに配置し、実装の良否判定に使用していきます。これを機に、より一層、品質向上に努めてまいります。



光学外観検査装置

